



# J-PlatPat利用ガイド【ススメ特別編】

## ～3つのポイントでわかる企業の定性情報～



J-PlatPatとは…

取引先企業の「技術力」「ブランド」を支える「特許」「商標」等の知財の情報を簡単・迅速・無料で収集できる検索ツールです！

J-PlatPatは特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供しています。

J-PlatPat

検索

知財の情報をコミュニケーションに活用すると…

取引先企業と技術やブランドに関して具体的にコミュニケーションすることで、「強み」等の定性情報への理解が深まります！

コミュニケーションが深まると…

取引先企業と他社と「強み」の比較や、中長期的な「強み」の維持向上の点から、取引先企業の課題やニーズ発掘につながります！



3つのポイントをおさえて  
J-PlatPatを使ってみよう！

### 【ポイント1】

取引先企業の知財（特許や商標）から何が「強み」かを知ろう

a

特許・実用新案、意匠、商標の簡単検索 ? ヘルプ

特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。  
分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。

特許・実用新案を探す 日本〇〇工業 AND 検索

ヒット件数 24件 一覧表示

特許・実用新案テキスト検索 検索結果

検索結果一覧

件数表示 \* 検索結果一覧

検索結果 27件

発明の名称 出願日

特開2010-227726

特開2010-227727

特開2010-227728

b

特開… センサー 日本〇〇工業 待開…

項目表示 イメージ表示 PDF表示

全項目 著者+要約+請求項範囲

著者 要約 募求の範囲 詳細な説明 図面

詳細な説明

c

【発明の詳細な説明】

【技術分野】  
【0001】

本発明は、半導体を検査する検査装置および検査方法に関する。

【背景技術】  
【0002】

半導体の検査においては、半導体ウェハーに含まれている……を測定する際に、光源から半導体ウェハーに光が照射され、……を測定される。しかしながら、……については、……できない。

【発明が解決しようとする課題】  
【0010】

そこで、上記の点に鑑み、本発明の目的としては、半導体ウェハーを検査する際に、……であっても、……を正確に測定することである。

【課題を解決するための手段】  
【0011】

以上の課題を解決するため、設定値に応じた光度の光を照射する光源と、…を用いて、…の際に、…を補正することによって、光源が…される制御回路を備える。

a. ツールバーに取引先企業名を入力して「検索」ボタンをクリック。

※ ツールバー左の「特許・実用新案」「商標」を選択

⇒ ヒット件数表示後に「一覧表示」をクリックして一覧画面へ。

※（社名変更や入力ミス以外で）ヒット件数が0の場合は、出願せずノウハウを秘密情報として管理している可能性あり。

b. 「発明の名称」「出願日」から、いつ、どのような知財（特許や商標）を出願しているか理解。

⇒ 1つの知財（特許や商標）をクリックして個別画面へ。

#### ＜技術…特許の場合＞

※「詳細な説明」ページで…

c. 「技術分野」から技術の使途を理解

d. 「発明が解決しようとする課題」から、どのような点がすごい技術なのか（強みなのか）を理解

#### ＜ブランド…商標の場合＞

商標の場合は、取引先企業の一覧画面・個別画面に商標として出願している「名称」や「ロゴ」が表示される。

⇒ 取引先企業の製品やサービスの「こだわり」が「名称」や「ロゴ」に反映されているかで、「ブランド」づくりの徹底度合いを理解

## 【ポイント2】

### 他社の知財（特許や商標）と比較して、取引先企業の「競争力」を知ろう

特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索 ? ヘルプ  
特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡単検索ができます。  
分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。

特許・実用新案を探す 半導体 検索 センサー AND 検索 ヒット件数 144件 一覧表示

特許・実用新案アカウント検索 [戻る] [戻る] [ヘルプ]  
検索結果一覧  
検索結果 27件  
表示形式: \* 添付イメージ表示 PDF表示  
検索結果 27件  
出願人 (登録公報-1)の権利は権利者を表示  
出願日 出願号 登録IPC  
1 特開.. センサー 東京■■センサー 特開.....  
2 特開.. センサー 西日本△△センサー 特開.....  
3 特開.. センサー 日本〇〇工業 特開.....

e. ツールバーに**取引先企業の製品やサービスの一般名称**を入力して「検索」ボタンをクリック。

※使途（例：半導体、検査）・製品（例：センター）等の複数キーワードでAND検索すると他社を抽出しやすい

⇒ ヒット件数表示後に「一覧表示」をクリックして一覧画面へ。

f. 取引先企業と同様の製品・サービスで、知財を出願している他社がわかる。

⇒ ポイント1のdのように、**他社の知財（特許や商標）を確認し、取引先企業との違いを知る**

⇒ **取引先企業の「強み」が、他社と比較して「競争力」を有しているかどうかがわかる。**

## 【ポイント3】

### 取引先企業の「強み」が今後も続くのかを知ろう

#### 書誌+要約+請求の範囲

- (19) 【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12) 【公報種別】公開特許公報(A)
- (11) 【公開番号】[REDACTED]
- (43) 【公開日】[REDACTED]
- (54) 【発明の名称】半導体不良の検出方法
- (51) 【国際特許分類】



【審査請求】有

【請求項の数】

【出願形態】

【全頁数】

(21) 【出願番号】[REDACTED]

(22) 【出願日】平成〇〇年〇月〇日(〇〇〇〇.〇.〇)

(71) 【出願人】

【識別番号】[REDACTED]

【氏名又は名称】日本〇〇工業

(74) 【代理人】

【識別番号】[REDACTED]

【弁理士】

【氏名又は名称】[REDACTED]

(74) 【代理人】

【識別番号】[REDACTED]

【弁理士】

【氏名又は名称】[REDACTED]

(74) 【代理人】

【識別番号】[REDACTED]

【弁理士】

【氏名又は名称】[REDACTED]

(72) 【発明者】

【氏名】〇〇〇〇

（個別画面をみると…）

g. 「出願日」から**権利の残存期間**（他社の同一技術・商標での出願・商品提供を抑止できる期間）を確認。

※ 特許権の残存期間は出願日から原則20年間（ただし、特許権は審査請求がされ（左記【審査請求】が「有」）、特許が付与されている必要がある）

※ 商標の残存期間は10年間（ただし登録更新が可能）

h. 「発明者」から、**取引先企業の開発体制**を把握。

⇒ <発明者が経営者のみの場合>

取引先企業は開発を経営者に依存している可能性あり。

<発明者が複数社員の場合>

社内の開発体制が潤沢な可能性あり。

もっと詳しく知りたい方は、「知財金融ポータルホームページ」から

「金融機関職員のための知的財産活用のススメ」をご参照ください！

（経営者との会話事例等を掲載したパンフレットが、無料でダウンロード可能！）

